

Název veřejné zakázky:

System pro 2D spektrální analýzu vad materiálů

I. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle ust. § 86 odst. 2 a § 156 odst. 1 písm. a) ZVZ

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:

Tato veřejná zakázka má zadavateli zajistit dodávku zařízení umožňující 2D spektrální analýzu povrchových a podpovrchových vad materiálů

Popis předmětu veřejné zakázky:

System pro 2D spektrální analýzu vad materiálů s příslušenstvím se skládá ze základní sady pro 2D testování obsahující hardwarový komunikační modul, software pro spektrální testování, řídicí notebook a kalibrační vzorky, dále z analyzátoru záření materiálu, sady budicích zdrojů, systému pro záznam rychlých dějů a příslušenství pro uchycení a manipulaci s měřenými vzorky a měřicím vybavením.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:

System pro 2D spektrální analýzu vad materiálů umožní zadavateli realizovat rozvoj a provádět analýzy v oblasti bezkontaktní spektrální analýzy povrchových a podpovrchových vad materiálů, což je jedním z předmětů řešení projektu CENTEM.

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek:

Pořízení daného zařízení je nutné pro splnění milníků řešení projektu CENTEM, prodlení způsobí nedodržení termínů milníků. S pořízením zařízení nejsou předpokládány žádné další finanční náklady.

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:

říjen 2013

Popis alternativ naplnění plánovaného cíle a zdůvodnění

Pro nedestruktivní povrchovou a podpovrchovou analýzu vad materiálů lze využít, např. RTG defektoskopii, ultrazvukovou defektoskopii, práškové metody a mnoho dalších.

Zdůvodnění zvolené alternativy:

Metody pro analýzu vad materiálů jsou většinou zaměřeny na konkrétní skupinu úloh, mají svá omezení a rizika (např. bezpečnostní rizika v případě RTG metod) a zpravidla vyžadují vysoký stupeň kvalifikace v daném oboru. Zvolený systém pro 2D spektrální analýzu vad materiálů představuje komplexní systém pro analýzu vad materiálů, který doplňuje a v některých případech překrývá možnosti standardních testovacích metod. Zadavatel

očekává jeho uplatnění nejen v tradičních technologiích, ale především v moderních technologiích (elektronika, solární technologie apod.), kde je využití standardních defektoskopických metod často komplikované a využití předmětu zakázky se jeví jako výhodnější řešení. Plánovaný systém a jeho princip také navazuje a vychází z předchozích zkušeností pracoviště a umožní efektivnější řešení dalších úkolů a plánovaných aktivit.

Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle:

Na pracovišti zadavatele aktuálně neexistuje komplexní systém pro 2D spektrální analýzu vad materiálů ani jiný pokročilý systém pro analýzu vad materiálu. Pořízení uvedeného zařízení je tedy pro dosažení plánovaných cílů zásadní.